05.2

Магнитная анизотропия игольчатых монокристаллических включений MnSb в матрице InSb

© А.И. Дмитриев^{1,2}, А.В. Кочура³, С.Ф. Маренкин^{4,5}, Е. Lähderanta⁶, А.П. Кузьменко³, Б.А. Аронзон⁷

¹Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

² Российский университет транспорта, Москва, Россия

³ Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия

⁴ Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

⁵ Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия

⁶ Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland

⁷ Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E-mail: alex-dmitriev2005@yandex.ru

Поступило в Редакцию 2 февраля 2021 г. В окончательной редакции 26 февраля 2021 г. Принято к публикации 27 февраля 2021 г.

Магнитная анизотропия игольчатых монокристаллических включений MnSb в матрице InSb определена и исследована в интервале температур 5–350 К. В гранулированных образцах InSb–MnSb наблюдается степенная зависимость константы анизотропии K(T) от намагниченности насыщения $M_S(T)$ в диапазоне температур 5–350 К с показателем степени $n = 3.2 \pm 0.4$ в соответствии с теориями, развитыми в работах Акулова, Зинера и Калленов.

Ключевые слова: магнитная анизотропия, антимонид марганца, эвтектическая композиция, намагниченность, ферромагнитный резонанс.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.10.50974.18723

Антимонид марганца — ферромагнитный полуметалл с гексагональной структурой типа NiAs [1] с наибольшей среди соединений Mn-BV температурой Кюри $T_{C} \approx 585 \, {\rm K}$ [2]. Интерес к этому материалу значительно возрос в последнее время в связи с перспективностью его применения для магнитного охлаждения [3]. Также MnSb обладает сильной магнитокристаллической анизотропией (МА), а направление оси легкого намагничивания (ОЛН) меняет свою ориентацию с изменением температуры, стехиометрии [1,4] и толщины в случае тонких пленок [5], что делает его пригодным для использования в устройствах магнитной записи повышенной плотности [6]. МА объемных и пленочных образцов MnSb и ее вариации с изменением температуры или стехиометрии изучены в [1,5,7–9]. Было установлено, что знак константы МА К, определяющийся направлением ОЛН, и величина К зависят от условий приготовления образцов, их состава и структуры. Однако синтез бездефектных кристаллов MnSb стехиометрического или близкого к нему составов затруднен ввиду малой растворимости Sb в матрице MnSb [10] и возможного формирования включений Mn₂Sb [11,12]. Поэтому в настоящей работе для исследования MA MnSb использовалась направленно закристаллизованная эвтектическая композиция InSb-MnSb, в которой игольчатые включения MnSb являются ориентированными [13-15].

Эвтектическая композиция InSb—MnSb была выращена методом Бриджмена с параметрами процесса синтеза, описанными в [13]. В качестве шихты использовались порошки, приготовленные из монокристаллического высокочистого InSb (93.5 mol.%) и MnSb (6.5 mol.%), полученного заранее прямым сплавлением исходных компонентов. Рентгенофазовый анализ показал наличие двух фаз: InSb и MnSb. С помощью дифракционных исследований ориентации кристалла вдоль оси роста установлено, что эвтектическая композиция представляет собой монокристаллическую матрицу InSb, ориентированную по направлению [110], содержащую монокристаллические включения MnSb с ориентацией [001]. Эти включения, согласно микроскопическим исследованиям, имеют форму игл, направленных вдоль оси роста, с длиной от 1 mm и диаметром от 1 до 5 μ m.

Полевые зависимости намагниченности M(H) образцов с характерными размерами $1 \times 1 \times 0.3$ mm измерялись с помощью СКВИД-магнитометра S600X (Сгуодепіс, Ltd.) в магнитном поле до 50 kOe в интервале температур T = 5-350 K. Зависимости спектров ферромагнитного резонанса (ФМР) от угла θ между линиями напряженности постоянного магнитного поля спектрометра и осью *с* включений MnSb при T = 300 K были получены с помощью спектрометра Bruker ELEXSYS-II E500 *X*-диапазона (9.4 GHz) с цилиндрическим резонатором ER4103TM. Ориентационная зависимость спектров ФМР измерялась с помощью программируемого гониометра ER 218PG1.

Вид магнитополевых кривых M(H) образца InSb-MnSb (рис. 1) типичен для ферромагнетиков с выраженной MA. При T = 350 K (рис. 1, *a*) для кривой, измеренной в случае, когда магнитное поле направлено поперек игл MnSb, наблюдается резкий рост



Рис. 1. Полевые зависимости намагниченностей *M* гранулированного образца InSb-MnSb, измеренные при температурах T = 350 (*a*) и 5 K (*b*) в двух ориентациях: вектор напряженности магнитного поля направлен вдоль (**H** \parallel **c**) и поперек (**H** \perp **c**) игольчатых монокристаллических включений MnSb. Штриховой линией отмечено поле магнитной анизотропии.

М в низких магнитных полях до 4 kOe, сменяющийся насыщением в магнитных полях, превышающих 4 kOe. Когда магнитное поле направлено вдоль игл MnSb, наблюдается плавное увеличение М в низких магнитных полях до 7 kOe, сменяющееся насыщением в магнитных полях, превышающих 7 kOe. Характер обеих кривых указывает на то, что ОЛН перпендикулярна длинной стороне игольчатых включений MnSb, т.е. их оси с. Оси игл были направлены вдоль кристаллографического направления [001]. Соответственно ось с включений MnSb является осью трудного намагничивания. Эта ситуация сохраняется до самой низкой температуры измерений $T = 5 \,\mathrm{K}$ (рис. 1, *b*). Во всем исследованном диапазоне температур при некотором значении напряженности магнитного поля зависимости M(H), измеренные вдоль и поперек ОЛН включений MnSb, достигают насыщения и принимают равные значения (рис. 1). Это значение является полем MA H_A , на основе которого по формуле $H_A = K/M_S$ можно оценить абсолютную величину эффективной константы МА К для каждой температуры [16], которая в свою очередь определяется как $K = 2K_1 + 4K_2$, где *K*₁, *K*₂ — константы МА первого и второго порядков соответственно, M_S — намагниченность насыщения. Величина К для включений MnSb принимает значения $(1.9 \pm 0.1) \cdot 10^{6} \text{ erg/cm}^{3}$ $(T = 350 \,\mathrm{K})$ И $(5.4 \pm 0.2) \cdot 10^6 \text{ erg/cm}^3$ (T = 5 K). Также были определены значения К при промежуточных температурах T = 100 и 200 К. Абсолютные значения К при T = 300 К составляли $1.2 \cdot 10^6$ и $0.4 \cdot 10^6$ erg/cm³ по данным, полученным с помощью крутильного магнитометра [1] и на основе ферромагнитного резонанса [8] соответственно. Отметим, что обсуждаемые здесь значения *M_S* и *K*, а также направление ОЛН справедливы для отдельной иголки. По данным сканирующей электронной микроскопии среднее расстояние D между иглами составляет ~ 25 μ m, их диаметр $d \sim 5 \mu$ m. Вклад диполь-дипольного взаимодействия в эффективное поле магнитной анизотропии определяется фактором $(d/D)^2$ и может быть оценен по формуле $4\pi M_S (d/D)^2$ [17,18]. Его величина равна ~ 375 Ое, что составляет ~ 2% от значения 15 kOe, наблюдаемого в эксперименте. В нашем случае $(d/D)^2 \sim 0.04 \rightarrow 0$, что соответствует случаю невзаимодействующих отдельных игл.

Для объемных кристаллов MnSb зависимость K(T)хорошо изучена при температурах выше комнатной [8]. При охлаждении до 77 К зависимость K(T) представлена в [1]. В этой работе зависимость $K_1(T)$ описывалась законом Акулова–Зинера, содержащим сомножитель Кара, который учитывает факт изменения размера элементарной ячейки соединения MnSb с температурой. МА для самых разнообразных ферромагнитных материалов довольно хорошо описывается теориями, развитыми в работах Акулова [19], Зинера [20] и Калленов [21]. Все они предсказывают степенную зависимость K *l*-го порядка $K_l(T)$ от намагниченности насыщения $M_S(T)$

$$\frac{K_l(T)}{K_l(0)} = \left[\frac{M_S(T)}{M_S(0)}\right]^n,$$

где n = l(l+1)/2. Здесь K(0) и $M_S(0)$ — значения соответствующих параметров при T = 0 К. При анализе экспериментальных данных в качестве K(0) и $M_S(0)$ использовались соответствующие значения при наименьшей доступной нам температуре T = 5 К. Спрямление зависимости нормированной эффективной константы анизотропии K(T)/K(0) от нормированной намагниченности насыщения $M_S(T)/M_S(0)$ (рис. 2) в двойных логарифмических координатах означает, что величина K прямо пропорциональна $(M_S)^n$ во всем диапазоне температур. При этом значение показателя n принимает



Рис. 2. Зависимость приведенной эффективной константы анизотропии K(T)/K(0) от приведенной намагниченности насыщения $M_S(T)/M_S(0)$ в двойных логарифмических координатах для образца InSb–MnSb. Сплошной линией показана аппроксимация линейной зависимостью.

значение $n = 3.2 \pm 0.4$. Это соответствует случаю, когда в величину эффективной анизотропии K(T) вносят сопоставимый вклад обе константы: первого (K_1) и второго (K_2) порядков, что согласуется с данными работ [1,8], где величина K_2 может составлять до 70% от значения K_1 .

Спектры ФМР образца InSb—MnSb (рис. 3, *a*) состоят из двух перекрывающихся линий лоренцовой формы. Интегральная интенсивность одной из них более чем на порядок превышает соответствующее значение для другой линии.

Ориентационная зависимость резонансного поля $H_{res}(\theta)$ основной линии ФМР в образце InSb-MnSb (рис. 3, *b*) обусловлена МА. Зависимость резонансного поля ФМР от угла θ с учетом первой и второй констант МА следует из свободной энергии, которая определяется выражением [22]:

$$E = \mathbf{H}\mathbf{M} - (K_{1\perp} - 2\pi M_S^2)\cos^2\theta - \frac{1}{2}K_{2\perp}\cos^4\theta$$
$$-\frac{1}{2}K_{2\parallel}\frac{1}{4}(3 + \cos 4\phi)\sin^4\theta + K_{1\parallel}\sin^2\theta\cos^2(\phi - \phi_{2\parallel}).$$
(1)

Резонансная угловая частота ω записывается в виде [23]:

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^{2} = \frac{1}{M_{S}^{2}} \left[E_{\theta\theta} \left(\frac{E_{\phi\phi}}{\sin^{2}\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} E_{\theta} \right) - \left(\frac{E_{\theta\phi}}{\sin\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \frac{E_{\phi}}{\sin\theta} \right)^{2} \right], \quad (2)$$

где E_{θ} , E_{ϕ} , $E_{\theta\theta}$, $E_{\phi\phi}$, $E_{\theta\phi}$ — первые и вторые частные производные свободной энергии (1) по соответствую-

щим углам. Дифференцируя уравнение (1) и подставляя производные в (2), можно получить выражение для зависимости $H_{res}(\theta)$ в неявном виде. Здесь оно не приводится ввиду громоздкости. На основе аппроксимации экспериментальной зависимости резонансного поля H_{res} основной линии ФМР от угла θ были определены значения констант $K_1 = -1.58 \cdot 10^6 \text{ erg/cm}^3$, $K_2 = 1.11 \cdot 10^6 \text{ erg/cm}^3$.

Таким образом, при T = 5-350 К измерены полевые зависимости намагниченности M(H) игольчатых монокристаллических включений MnSb в матрице InSb в двух ориентациях: вектор напряженности магнитного поля направлен вдоль и поперек игл. Анализ кривых M(H) позволил определить величину поля MA H_A для некоторых фиксированных значений температуры, а также направление ОЛН, которое оказалось перпендикуляр-



Рис. 3. Измеренные при T = 300 К для образца InSb-MnSb спектры ФМР в различных ориентациях магнитного поля спектрометра относительно оси *с* включений MnSb (*a*) и зависимость резонансного поля H_{res} основной линии ФМР от угла θ между линиями напряженности постоянного магнитного поля спектрометра и осью *с* включений MnSb (*b*).

ным оси с монокристаллических включений MnSb. Установлено, что величина K прямо пропорциональна $(M_S)^n$ в диапазоне температур 5–350 К с показателем степени $n = 3.2 \pm 0.4$ в соответствии с теориями, развитыми в работах Акулова, Зинера и Калленов. Значение показателя степени n соответствует случаю, когда в величину эффективной анизотропии K(T) вносят сопоставимый вклад обе константы: первого (K_1) и второго (K_2) порядков. По ориентационной зависимости спектров ФМР определены их величины $K_1 = -1.58 \cdot 10^6 \text{ erg/cm}^3$, $K_2 = 1.11 \cdot 10^6 \text{ erg/cm}^3$.

Благодарности

Авторы признательны А.В. Куликову за измерения спектров ФМР и Р.Б. Моргунову за полезные замечания.

Финансирование работы

Работа выполнена по теме госзадания № 0851-2020-0035.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов

Список литературы

- T. Okita, Y. Makino, J. Phys. Soc. Jpn., 25, 120 (1968). DOI: 10.1143/JPSJ.25.120
- S.F. Marenkin, A.V. Kochura, A.D. Izotov, M.G. Vasilév, Russ.
 J. Inorg. Chem., 63 (14), 1753 (2018).
 DOI: 10.1134/S0036023618140036
- [3] J.A. Cooley, M.K. Horton, E.E. Levin, S.H. Lapidus, K.A. Persson, R. Seshadri, Chem. Mater., 32, 1243 (2020). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b04643
- [4] Y. Ashizawa, S. Saito, M. Takahashi, J. Appl. Phys., 91, 8240 (2002). DOI: 10.1063/1.1452223
- [5] N. Nishizawa, H. Munekata, J. Cryst. Growth, 378, 418 (2013). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2012.11.040
- [6] N.A. Wibowo, C.F. Irawan, A. Setiawan, J. Phys.: Conf. Ser., 1153, 012054 (2019).
 - DOI: 10.1088/1742-6596/1153/1/012054
- [7] W.J. Takei, D. Cox, G. Shirane, Phys. Rev., **129**, 2008 (1963).
 DOI: 10.1103/PhysRev.129.2008
- [8] G. Markandeyulu, K.V.S. Rama Rao, J. Magn. Magn. Mater., 67, 215 (1987). DOI: 10.1016/0304-8853(87)90233-2
- [9] Y. Pan, G. Sun, Scripta Mater., 41, 803 (1999).
 DOI: 10.1016/S1359-6462(99)00228-6
- [10] I. Teramoto, A.M.J.G. van Run, J. Phys. Chem. Solids., 29, 347 (1968). DOI: 10.1016/0022-3697(68)90080-2
- [11] T. Chen, G.B. Charlan, R.C. Keezer, J. Cryst. Growth, 37, 29 (1977). DOI: 10.1016/0022-0248(77)90140-3
- [12] G.Y. Iwamoto, C. de Arruda Rodriges, L.A. de Sousa Iwamoto, R. de Almeida Vieira, Mater. Res., 22, e20180647 (2019).
 DOI: 10.1590/1980-5373-MR-2018-0647
- [13] В.М. Новоторцев, А.В. Кочура, С.Ф. Маренкин, И.В. Федорченко, С.В. Дрогунов, А. Lashkul, E. Lahderanta, ЖНХ, 56 (12), 2038 (2011).

- Y. Umehara, S. Koda, Metallography, 7, 313 (1974).
 DOI: 10.1016/0026-0800(74)90012-3
- [15] И.Х. Мамедов, Д.Г. Араслы, А.А. Халилова, Р.Н. Рагимов, Неорган. материалы, **52** (4), 468 (2016). DOI: 10.7868/S0002337X16040102
- [16] K.-D. Durst, H. Kronmüller, J. Magn. Magn. Mater., 59, 86 (1986). DOI: 10.1016/0304-8853(86)90014-4
- [17] Ф.Б. Мушенок, А.И. Дмитриев, М.В. Кирман, С.М. Алдошин, Н.А. Санина, Р.Б. Моргунов, ФТТ, **52** (10), 1992 (2010). [Пер. версия: 10.1134/S1063783410100197].
- [18] A.B. Drovosekov, N.M. Kreines, A.S. Barkalova, S.N. Nikolaev, V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov, J. Magn. Magn. Mater., 495, 165875 (2020). DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165875
- [19] N. Akulov, Z. Phys., 100, 197 (1936).DOI: 10.1007/BF01418601
- [20] C. Zener, Phys. Rev., 96, 1335 (1954).DOI: 10.1103/PhysRev.96.1335
- [21] H.B. Callen, E. Callen, J. Phys. Chem. Solids, 27, 1271 (1966).
 DOI: 10.1016/0022-3697(66)90012-6
- B. Schulz, K. Baberschke, Phys. Rev. B, 50, 13467 (1994).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.50.13467
- [23] L. Baselgia, M. Warden, F. Waldner, S.L. Hutton, J.E. Drumheller, Y.Q. He, P.E. Wigen, M. Maryško, Phys. Rev. B, 38, 2237 (1988). DOI: 10.1103/PhysRevB.38.2237